

IR(赤外)顕微鏡 : Infra Red microscope

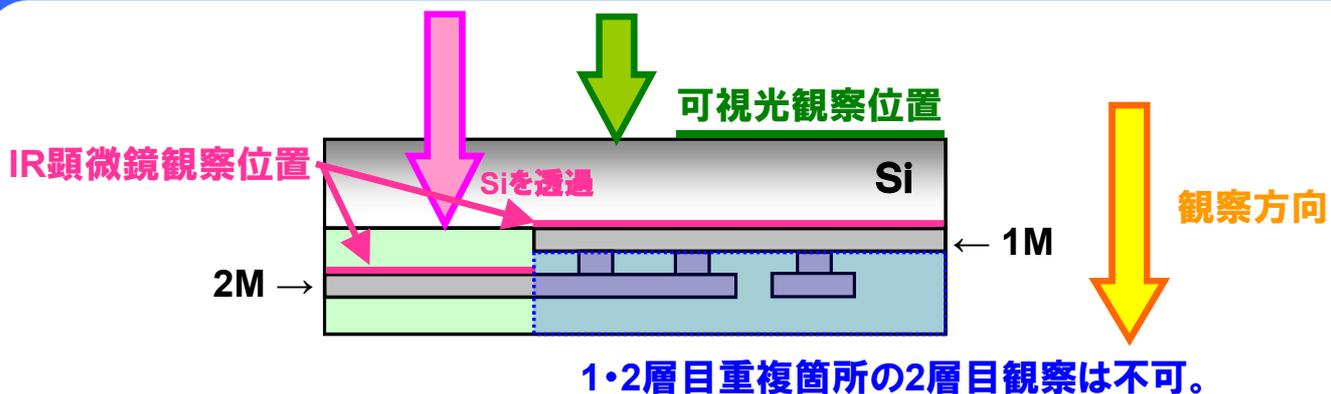
## ■原理

Siを透過するIRレーザーを用い、上層のメタルに隠れて見えない下層配線等をSi裏面側より透過観察する。

## ■観察条件

- IRレーザーはメタルを透過しないため、チップ裏面のメタル除去が必要。
- 透過観察時はSi面の鏡面仕上げが必要。
- Si基板の不純物濃度が高い試料は、Si薄厚化仕上げが必要。

## ■装置概要



## ■観察事例

